2023.3 PF SAXS-UG Meeting

2023.3.14 18:00-19:00

議題

- 1. 現状報告:
- 2. 施設報告•案内
- 3. PF研究会(BL11-twobeamビームラインについて)
- 3. 研究会について
- 4. その他 (ご提案など)

現状報告

• 現幹事

代表 奥田浩司(京大工) 金属・無機

副代表 上久保裕生(奈良先端大) 生命・生物

山本勝宏(名工大) 高分子

幹事 菱田真史(筑波大)脂質

小川紘樹(京大化研)高分子

小田隆(立教大)生命•生物

井上倫太郎(京大複合研)生命生物

石毛亮平(東工大)高分子

森田剛(千葉大)ソフトマター

櫻井伸一(KIT) 高分子、前代表

[顧問] 平井光博先生(群馬大)櫻井伸一先生(KIT)

* 分野についてなど(例えばイメージングなど)

施設側から

- ・利用状況・申請状況、申請カテゴリーなど
- ・電気代急騰と今年度の運転見込み
- システムの改良など

BL11**の**2ビームBL建設に関連して

関連PF研究会 2022.11(PFスタッフによる検討)→Hybrid ring への助走

https://doi.org/10.1107/S1600577521012753

11月6日(日)	
10:15~10:30	開会挨拶 解良 聡(分子研UVSOR・施設長)、島田 賢也(広島大HiSOR・センター長)
10:30~11:00	概要説明 船守 展正(KEK物構研・PF施設長)
11:00~11:30	ハイブリッドリングの検討状況 原田 健太郎(KEK加速器・加速器第六研究系)
11:30~12:00	開発研究多機能ビームラインBL-11の検討状況 若林 大佑(KEK物構研・放射光実験施設)
12:00 ~ 13:00	(昼食)
13:00~15:00	2ビーム利用の検討状況 TBA
15:00 ~ 15:10	(休憩)
15:10~16:10	総合討論 TBA
16:10~16:20	閉会挨拶 小杉 信博(KEK物構研·所長)

関連PF研究会 2023.1(UG側からの提案)

- 提案(敬称略) 平井、森田、石毛、奥田 +PF(高木)

小角散乱グループ (BL6A,BL10C,BL15A2: http://pfwww.kek.jp/saxs/)

手法の特徴 -

小角領域に現れるナノ構造を「ナノ領域での電子密度分布の変調」として計測評価する。散漫な散乱であるため、空気散乱などの影響を嫌う。

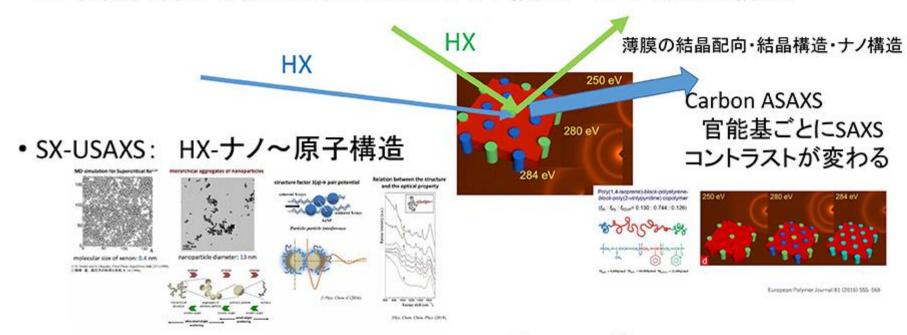
- *小角領域に現れるのが「ナノ構造の形状因子」「長周期結晶構造」。 研究対象が構造の階層性を持っている場合が多いため、
- * 同時に高角(回折)、極小角などを組み合わせる場合が多い。
- * 部分構造の抽出のため、異常分散効果(吸収端低エネルギー側)を使う異常小角散乱法が使われる。
- * その場測定(時分割測定、ストップドフローなど)同時測定(光、DSCなど)を多用する。

研究対象の特徴 - 長さスケールを共にする非常に広い分野

- * 生物・生体高分子・タンパク溶液 などの生物系物質の構造と構造変化
- * 高分子・液晶などの有機物質の構造と相変態
- * 溶液の物理化学、超臨界、物質合成
- * 無機・金属材料の構造と相転移過程

SAXS-UG

・SX-有機材料の官能基分別SAXS:HX-ナノ構造~分子(結晶)構造



- SX-ASAXS & XAFS: HX~TenderX: マイクロトモグラフィー
 - → 複合構造体:トモグラフィーで位置特定→位置特定時分割XAFS
 - → DispersiveXAFSなどによる分光・散乱とIn-situTomographyの同時計測

群馬大半井

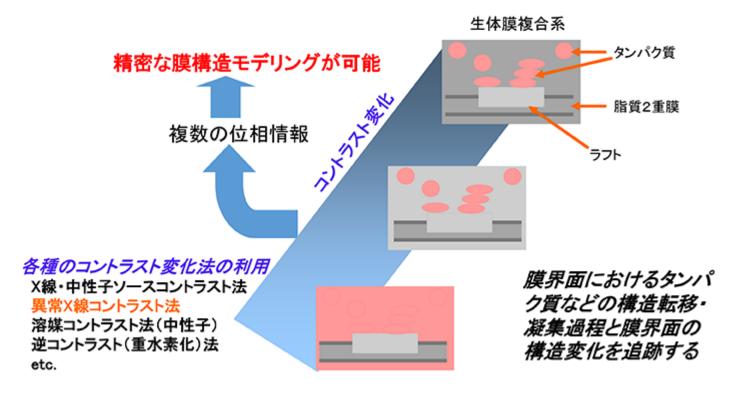
提案例(2)

基礎生命科学テーマ(例): 生体膜情報伝達系の構造と機能の解明

膜構成成分の構造の分離

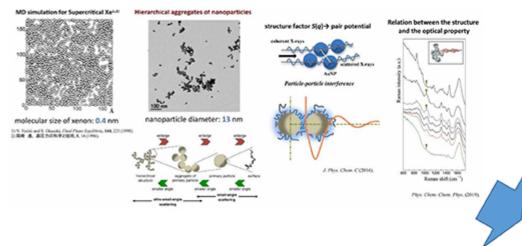
X線・中性子散乱/反射率、斜入射X線とコントラスト変化観測

(SWAXS, A-WAXS, GI-SAXS, XR, SANS, NR, NSE)



提案例(3)

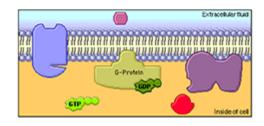
・表面敏感なUSAXS-SAXS-WAXD同時計測の可能性



Tender — HX連携 バルク溶液中の WAXD-SAXS-USAXS連携測定 SX-Tender連携 膜表面/液面表面などでの化学シフトASAXS/TenderASAXS連携計測(CとP,SのASAXS/AUSAXS)

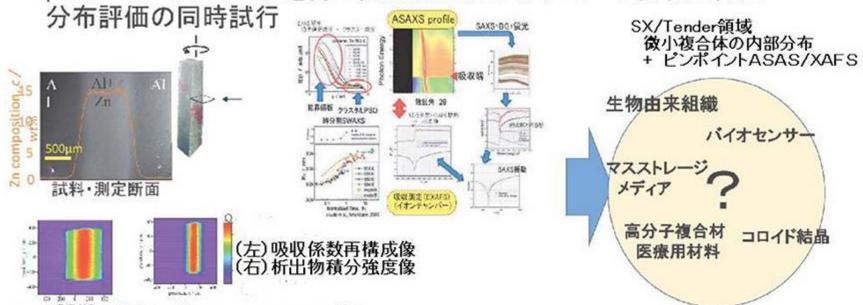
ラフト構造⇒膜構造/膜たんぱく質⇒機能部位構造 ↔

細胞膜情報伝達



提案例(4)

・μmレベルで不均一性を持つ実用材における不均一性評価と特性



HardX領域での散乱トモグラフィー/ASAXS/XAFS併用ナノ構造解析 試料スケール: サブmm 位置分解10μm (吸収像(左)に対し、小角散乱強度像が得られる(右は半径2nm程度の析出物の積分強度像)

有機複合体(生体構造、有機電極構造、etc)の内部 セミマイクロ構造分布(投影分布またはトモグラ フィー)と構造選択ASAXSへ 試料スケール:μm程度 位置分解 数十nm ユーザーからの提案(SAXS-UG) 高分子フィルム製膜過程におけるin-situ深さ構造解析

PF研究会「開発研究多機能ビームラインの建設と利用」② 2023年1月5日(木), 14:35~15:55 A会場(オンライン)

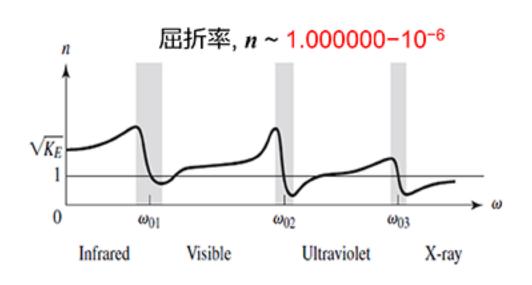
東京工業大学物質理工学院 応用化学系 (機能物性分野) 石毛 亮平

HX & SX 同時利用で何が測定できるか?



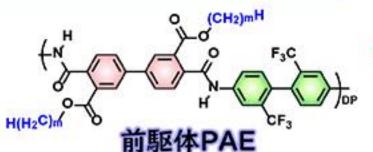
GI-WAXS/SAXS測定(基板上の薄膜の構造解析)

- ・X線領域の全反射現象を利用
- ・臨界角は使用する光の波長に依存
- ・侵入長は波長と入射角に依存(短波長ほど高い分解能)
- ・X線領域では密度の増加に伴い, 屈折率は減少(プリズム が不要)
- → 薄膜の深さ方向の構造変化を高分解能で分析可能



液晶を活用した剛直分子の配列制御 (2)





焼成

配向を保ちつつ 剛直分子に変換

ポリイミド(PI)

前駆体

希薄溶液

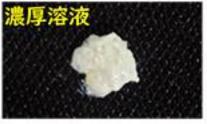


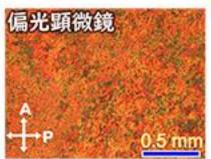


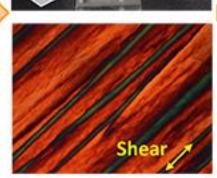
濃厚溶液

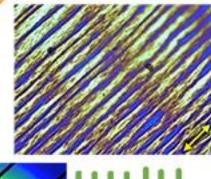


K. Tanaka, S.Ando, R. Ishige*, Macromolecules 2019, 52, 5054



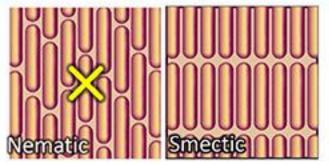


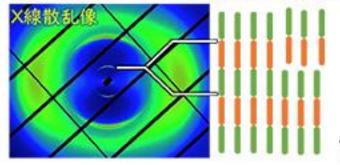




ポリイミド

350 °C

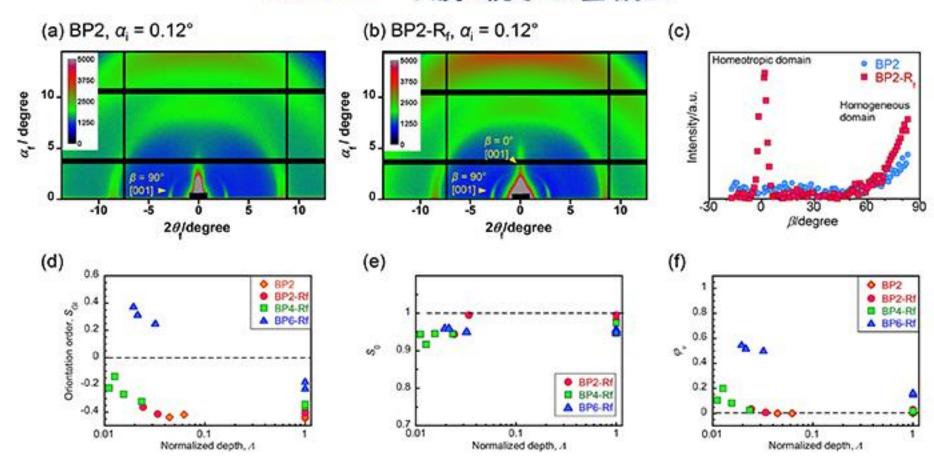




垂直配向分率の深さ依存性: GI-WAXS



スピンコート膜:親水Si基板上



末端R_f なし:垂直配向ドメインなし

末端R, あり:表面付近に垂直配向ドメイン

→ R.基の効果, 親水基板界面における水平配向誘起

提案についての技術的課題など

<SX散乱+HX散乱>の利用

- -用途: C吸収端(SX)-S,P吸収端(Tender)の異常小角散乱
 - + HXによるナノ構造~結晶配向の同時計測
- → 双方の散漫散乱: 散乱範囲のオーバラップ: 時間分配(TimeSharing)測定 SX: ASAXS、HX: 微細構造~結晶配向

<SX分光+HX散乱>の利用

→ HXの検出器にSX吸収アッテネータ(窓材)を付加すれば問題ない。 SXは走査による分布解析など。

<Tender:ASAXS+HX:トモグラフィー:SX:ASAXS+Tender:トモグラフィー>

→ 後者は微小不均一試料対象:SXマイクロビーム、Tenderセミマイクロビーム必須

【ウェット条件でのLive計測(生物試料等)】

→ C汚染は防げるのか。 + LowDoseでのSAXS評価法の開発(MD併用教育データでの深層学習?)

く低エネルギーでの2dSAXSの課題>

→ Ewald球の曲率が無視できず : 3次元スキャンの必要性(散乱の対称性による) SXのUSAXS⇒ 曲率の影響は少ない

→小まとめ

- 小角散乱グループとして展開を期待している方向性
- 1. SXでの化学シフト(特にC)の利用によるASAXSと(HXでの結晶構造解析またはnmスケールの不均一性)の同時評価による官能基識別構造解析
 - 2. 複数波長による同一試料同時測定をつかった
 - 複数深さ同時構造評価
- USAXS-SAXS-WAXD時分割同時広階層構造計測(表面敏感測定): UndulatorであればSpeckle解析も可能か。
 - 3. 投影またはトモグラフィー(TX,HX)によるマクロ不均一性評価と同時にSXでのケミカルシフト敏感ASAXS/XAFS

研究会について

・今年度(後半)に開催する可能性 <2023年度後期フォトンファクトリー研究会への応募>

開催期間:2023年9月~2024年3月

応募締切日:2022年6月??日

[年2回(前期と後期)募集しています]

例: 手法に関する分野横断研究会 (SX利用(C,N,O)、SWAXS,In-situ, ASAXS、XAFSなどとの組み合わせ解析など)

その他